

## ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК МАГНИТНОГО ПОЛУПРОВОДНИКА $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$

В. Ф. Кабанов, А. М. Свердлова

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, 410601, Саратов,  
Россия

(Получена 25 января 1993 г. Принята к печати 18 марта 1993 г.)

Рассмотрены фотомагнитные эффекты в пленках магнитного полупроводника  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  на кремниевой подложке *p*-типа проводимости при освещении белым светом до 100 лк при  $T = 77$  К. Обнаружено увеличение поперечного тока через пленку окисла редкоземельного элемента с ростом напряженности магнитного поля до 6.1 кГс. Полученная зависимость носит линейный характер. Изменение тока в магнитном поле от освещенности имеет максимум. Увеличение тока в магнитном поле с ростом освещенности  $L$  (при малых  $L$ ) объясняется с точки зрения усиления обменного взаимодействия через фотоэлектроны проводимости, уменьшение тока связывается со снижением числа магнитных ионов в материале.

Известно, что некоторые окислы редкоземельных элементов (ОРЗЭ) являются магнитными полупроводниками (МП). Среди таких материалов значительный интерес представляют пленки твердого раствора  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  в связи с достаточно высоким удельным сопротивлением ( $10^8$ — $10^{10}$  Ом·см) и относительно высокой температурой Кюри  $T_c$ , достигающей 140 К [1]. Однако фотоэлектрические и фотомагнитные свойства пленок ОРВЭ на кремниевой подложке изучены явно недостаточно. Попытка восполнить этот пробел сделана в настоящей работе.

Известно, что МП обладают хорошей магниточувствительностью в области фазового перехода (вблизи  $T_c$ ) и в ферромагнитной области, а пленки ОРВЭ фоточувствительны в этой области температур. В связи с этим важным представляется исследование пленок ОРВЭ  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  при действии освещения и магнитного поля, т. е. исследование фотомагнитных свойств.

Образцы представляли собой МДП структуры  $\text{Al}-\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}-\text{Si}$ . На кремниевую подложку *p*-типа проводимости наносились пленки твердого раствора  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  методом термического испарения в вакууме соответствующей лигатуры с последующим окислением. Толщина пленок составляла 0.1 мкм. Удельное сопротивление пленок на 6—8 порядков превышало удельное сопротивление подложки, что позволяло использовать их в качестве диэлектрика в МДП структурах. Полевыми электродами служили алюминиевые контакты площадью 1 мм<sup>2</sup>.

Исследуемые образцы при температуре жидкого азота ( $T = 77$  К) помещались в постоянное магнитное поле величиной до 6.1 кГс и освещались белым светом со стороны диэлектрика. Поглощение света практически происходило в пленке ОРЗЭ, так как для  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  в диапазоне длин волн  $\lambda = 0.5$ — $0.6$  мкм коэффициент поглощения имеет величину порядка  $10^5$  см<sup>-1</sup> [2]. Использовалась освещенность до 100 лк, что соответствовало мощности излучения  $1.5 \cdot 10^{-7}$  Вт, при которой разогрев исследуемого образца отсутствует. Поперечный ток через МДП структуру определяется главным образом сопротивлением объема диэлектрика и области пространственного заряда в полупроводнике. На МДП структуру подавалось прямое смещение величиной 1.5—2.0 В, которое создавало

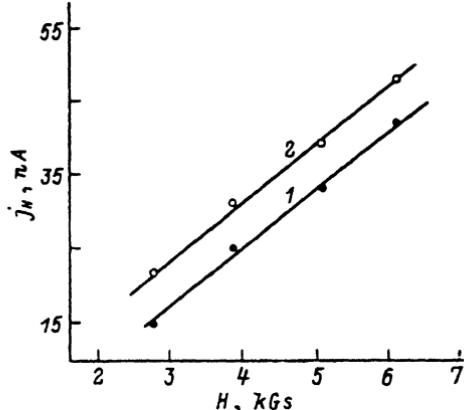


Рис. 1. Зависимость изменения тока в магнитном поле от напряженности поля при прямом смещении на МДП структуре с пленкой  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$ . Напряжение смещения, В: 1 — 1, 2 — 2.  $T = 77$  К.

режим обогащения основными носителями заряда на границе магнитный полупроводник—кремний. В этом случае доминирующим фактором в процессах токопереноса становится сопротивление объема диэлектрика, т. е. измеряемый ток отражает свойства пленки ОРЭЗ.

В работе получено увеличение плотности поперечного тока через МДП структуру в постоянном магнитном поле:

$$j_H = j(H) - j_0,$$

где  $j(H)$  — плотность тока через МДП структуру в магнитном поле  $H$ ,  $j_0$  — плотность тока в отсутствие магнитного поля.

Увеличение тока может происходить за счет изменения концентрации свободных носителей заряда или их подвижности. Относительно малая величина эффекта ( $j_H/j_0 \approx 0.1 \pm 1\%$ ) позволяет считать, что изменение тока происходит за счет изменения подвижности. Последнее может быть объяснено эффектом отрицательного магнитосопротивления, характерного для ферромагнитных полупроводников: магнитное поле уменьшает флуктуации намагниченности, что приводит к уменьшению рассеяния на них свободных носителей, к росту подвижности и соответственно тока через МДП структуру.

Обнаружена линейная зависимость  $j_H$  от  $H$  в рассматриваемом диапазоне магнитных полей (рис. 1). Известно, что в ферромагнитной области намагниченность  $M$  материала в относительно слабых магнитных полях также линейна по  $H$  [3]:  $M = xH$ , где  $x = Nm/3kT$  — магнитная восприимчивость,  $N$  — количество магнитных ионов,  $m$  — величина магнитного момента одного иона.

Приведенные выше рассуждения позволяют сделать вывод о том, что полученная в работе линейная зависимость  $j_H$  от магнитного поля отражает поведение намагниченности материала.

На рис. 2 приведена типичная зависимость  $j_H$  от освещенности  $L$  пленки  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  ( $x = 0.1$ ). Видно, что зависимость имеет максимум в районе 10—20 лк. При этих же освещенностях наблюдается особенность на кривой фототока  $j_{ph}$  (рис. 2, б) — излом характеристики.

Из сравнения кривых видно, что в области освещенностей до 20 лк существенно увеличивается концентрация свободных носителей заряда. Известно, что в кристаллах МП электроны проводимости стремятся установить ферромагнитное упорядочение. Как показано в [4], эффективный обменный интеграл существенно зависит от концентрации электронов проводимости ( $I_{eff} - n^2$ ), т. е. обменное

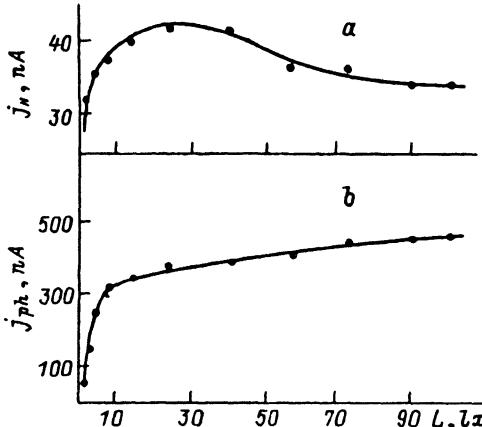


Рис. 2. Зависимости изменения тока в магнитном поле  $H = 6.1$  кГс (a) и фототока (b) от освещенности для пленки  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  ( $x = 0.10$ ).  $T = 77$  К.

взаимодействие сильно возрастает с увеличением  $n$ . Усиление обмена приводит к увеличению намагниченности материала и, как следствие, к росту подвижности. В ферромагнитной области для невырожденного МП имеем [4]:  $\mu \sim (I_{\text{eff}} \cdot S)^2$ . Увеличение подвижности с ростом концентрации фотоэлектронов при малых  $L$  приводит к росту  $j_H$  (рис. 2, 3). Таким образом, можно предположить, что в данных условиях имеет место так называемый «процесс фотонамагничивания».

При освещенности более 20 лк наблюдается резкое замедление (в 50—75 раз) роста фототока (рис. 2, b) и спад  $j_H$  с освещенностью (рис. 2, a). Это может быть связано с тем, что при освещении МП возможно протекание двух процессов: увеличение концентрации свободных носителей заряда в зоне проводимости ОРЭ (фототок) и уменьшение количества магнитных ионов  $\text{Eu}^{2+}$  (за счет переходов  $4f^7 - 5d^1$ ). Для фототока имеет место известный эффект насыщения  $j_{\text{ph}}$  с ростом освещенности. Ход зависимости  $j_H$  от  $L$  в этой области свидетельствует о том, что уменьшение количества магнитных ионов  $\text{Eu}^{2+}$  снижает намагниченность

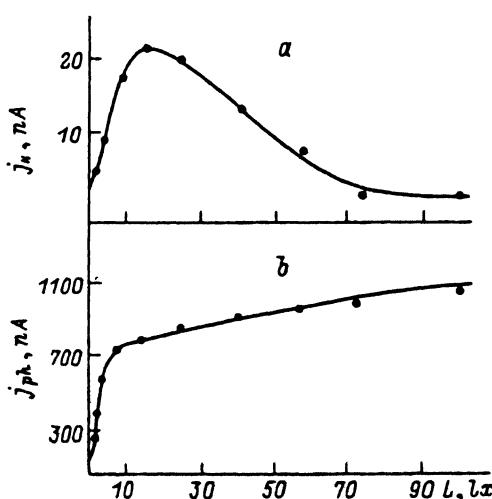


Рис. 3. Зависимости изменения тока в магнитном поле  $H = 6.1$  кГс (a) и фототока (b) от освещенности для пленки  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  ( $x = 0.19$ ).  $T = 77$  К.

пленок сильнее, чем происходит отмеченный выше рост ее за счет ферромагнитного упорядочения. Этот эффект можно рассматривать как процесс фоторазмагничивания.

При больших освещенностях ( $L > 80$  лк) происходит насыщение зависимости  $j_H(L)$ , связанное, по-видимому, с установлением динамического равновесия между фотонамагничиванием и фоторазмагничиванием.

Типичная зависимость  $j_H(L)$  при увеличении процентного содержания Sm в пленке твердого раствора до 19% приведена на рис. 3. Видно, что максимум характеристики сдвигается в область больших значений освещенности, становится более размытым.

Известно, что ионы редкоземельных элементов в соединениях сохраняют магнитные моменты [5]. Так, магнитные ионы  $\text{Eu}^{2+}$  имеют полный магнитный момент  $J = 7/2$ , ионы  $\text{Sm}^{3\pm}$  —  $J = 5/2$ , а ионы  $\text{Sm}^{2+}$  и  $\text{Eu}^{3+}$  обладают полным моментом  $J = 0$ , т. е. являются немагнитными. В процессе взаимодействия света с пленкой твердого раствора  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  происходит не только отрыв валентных электронов у  $\text{Eu}^{2+}$  и превращение его в  $\text{Eu}^{3+}$ , но и процесс ионизации  $\text{Sm}^{2+} \rightarrow \rightarrow \text{Sm}^{3+}$ , т. е. наряду с уменьшением количества магнитных ионов Eu происходит одновременное увеличение количества магнитных ионов Sm. Последний процесс значительно слабее влияет на рассмотренные эффекты в связи с малой концентрацией ионов Sm в твердом растворе (~10%). При увеличении концентрации Sm в твердом растворе до 19% вклад его становится заметным (ср. рис. 2 и 3) и для получения эффекта фоторазмагничивания требуются большие значения освещенности.

Таким образом, в работе рассмотрены фотомагнитные эффекты в пленках магнитного полупроводника  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$  на кремниевой подложке  $p$ -типа проводимости при освещении белым светом до 100 лк при  $T = 77$  К. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: увеличение тока в магнитном поле с ростом освещенности (при малых  $L$ ) происходит благодаря усилию обменного взаимодействия через фотоэлектроны проводимости, уменьшение тока — в связи со снижением числа магнитных ионов в материале. Показано, что на последний процесс может существенно влиять процентное содержание ионов Sm в твердом растворе  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$ .

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] В. Г. Бамбуров, А. С. Борухович, А. А. Самохвалов. Введение в физико-химию ферромагнитных полупроводников. М. (1988).
- [2] В. Ф. Кабанов. ФТП, 26, 157 (1992).
- [3] С. Тикадзуми. Физика ферромагнетика. Магнитные свойства вещества. М. (1983).
- [4] Э. Л. Нагаев. Физика магнитных полупроводников. М. (1979).
- [5] Р. Уайт. Квантовая теория магнетизма. М. (1985).

Редактор Л. В. Шаронова